

PSS1R5- \* - \*

# RELIABILITY DATA

信頼性データ

DWG.No. C183-57-01B		
承認	査閲	担当
Kurosawa	Y. Kihama	H. Shimizu
28. Apr. '06	28. Apr. '06	28. Apr. '06

## I N D E X

	PAGE
1. MTBF 計算値 Calculated Values of MTBF .....	R-1
2. 部品デイレティング Component Derating .....	R-2
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\Delta T$ List .....	R-4
4. アブノーマル試験 Abnormal Test .....	R-5
5. 振動試験 Vibration Test .....	R-9
6. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test .....	R-10
7. はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test .....	R-11
8. 熱衝撃試験 Thermal Shock Test .....	R-12
9. 高温貯蔵試験 High Temperature Storage Test .....	R-14
10. 低温貯蔵試験 Low Temperature Storage Test .....	R-15
11. 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test .....	R-16
12. 高温連続通電試験 High Temperature Bias Test .....	R-17

※ 信頼性試験は、代表データであり、全ての製品は、ほぼ同等な特性を示します。  
従いまして、この値は実力値とお考え願います。

The following data are typical values. As all units have nearly the same characteristics, the data to be considered as ability values.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : PSS1R5-48-5

(1) 算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(\*1)で算出されています。

故障率 $\lambda_{SS}$ は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって決定されます。

Calculated based on parts stress reliability projection of Telcordia (\*1).

Individual failure rate  $\lambda_{SS}$  is calculated by the electric stress and temperature rise of the each device.

\*1: Telcordia (Bellcore) "Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment"  
(Document number TR-332, Issue5)

<算出式> 
$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m \lambda_{SSi}} \times 10^9 \text{ 時間 (hours)}$$

$$\lambda_{SSi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti} \cdot \pi_E$$

- $\lambda_{equip}$  : 全機器故障率 (FITs) Total Equipment failure rate (FITs = Failures in  $10^9$  hours)
- $\lambda_{Gi}$  :  $i$ 番目の部品に対する基礎故障率 Generic failure rate for the  $i$ th device
- $\pi_{Qi}$  :  $i$ 番目の部品に対する品質ファクタ Quality factor for the  $i$ th device
- $\pi_{Si}$  :  $i$ 番目の部品に対するストレスファクタ Stress factor for the  $i$ th device
- $\pi_{Ti}$  :  $i$ 番目の部品に対する温度ファクタ Temperature factor for the  $i$ th device
- $m$  : 総部品点数 Number of total device
- $\pi_E$  : 機器の環境ファクタ Equipment environmental factor

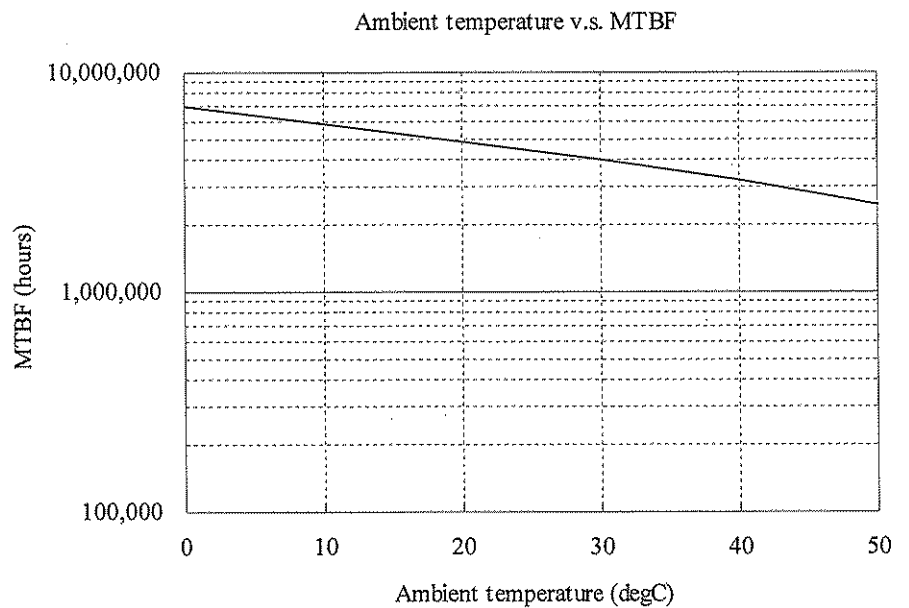
(2) MTBF値 MTBF Values

条件 Conditions :  $V_{in} = 48VDC$   
Environment GB (Ground, Benign)

PSS1R5-48-5

Output current: 0.3A (100%)

Ambient Temperature	MTBF
0°C	6,949,318 (hours)
25°C	4,405,155 (hours)
50°C	2,505,249 (hours)



— PSS1R5-48-5 Load 100%

## 2. 部品ディレーティング Component Derating

MODEL : PSS1R5-\*\*-5

## (1) 算出方法 Calculating Method

## (a) 測定条件 Measuring Conditions

・入力電圧	: 定格	・出力電流	: 100%
Input Voltage	Rated	Output Current	
・周囲温度	: 50℃	・取付方法	: 水平取付 (ケース面上)
Ambient Temperature		Mounting Method	Horizontal Mounting
・冷却方式	: 自然空冷		
Cooling	Convection Cooling		

## (b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力および熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め、最大定格との比較を行いました。

The maximum rating temperature is compared with junction temperature which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

## (c) IC、抵抗、コンデンサー等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation, etc are within derating criteria.

## (d) 熱抵抗算出方法 Calculating Method of Thermal Impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(\max)} - T_c}{P_{c(\max)}} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_{j(\max)} - T_a}{P_{c(\max)}} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_{j(\max)} - T_l}{P_{c(\max)}}$$

$T_c$  : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25℃  
Case Temperature at Start Point of Derating ; 25℃ in General

$T_a$  : ディレーティングの始まる周囲温度 一般に25℃  
Ambient Temperature at Start Point of Derating ; 25℃ in General

$T_l$  : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25℃  
Lead Temperature at Start Point of Derating ; 25℃ in General

$P_{c(\max)}$  : 最大コレクタ(チャンネル)損失  
(  $P_{ch(\max)}$  ) Maximum Collector(Channel) Dissipation

$T_{j(\max)}$  : 最大接合点温度  
(  $T_{ch(\max)}$  ) Maximum Junction(Channel) Temperature

$\theta_{j-c}$  : 接合部からケースまでの熱抵抗  
(  $\theta_{ch-c}$  ) Thermal Impedance between Junction(Channel) and Case

$\theta_{j-a}$  : 接合点から周囲までの熱抵抗  
Thermal Impedance between Junction and Air

$\theta_{j-l}$  : 接合点からリードまでの熱抵抗  
Thermal Impedance between Junction and Lead

## (2) 部品ディレーティング表 Component Derating List

## MODEL : PSS1R5-5-5

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 MAX Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Factor	備考 Note
Q1	CHIP MOS FET	Tch(max):150℃	Tch : 67.7 °C	45.1%	
Q2	CHIP TRANSISTOR	Tj(max):150℃	Tj : 67.0 °C	44.7%	
D101	CHIP S.B.D	Tj(max):150℃	Tj : 70.8 °C	47.2%	
Z2	CHIP ZENER	Tj(max):150℃	Tj : 76.6 °C	51.0%	
A101	CHIP I.C	Tj(max):150℃	Tj : 64.4 °C	42.9%	

## MODEL : PSS1R5-12-5

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 MAX Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Factor	備考 Note
Q1	CHIP MOS FET	Tch(max):150℃	Tch : 68.6 °C	45.7%	
Q2	CHIP TRANSISTOR	Tj(max):150℃	Tj : 72.3 °C	48.2%	
D101	CHIP S.B.D	Tj(max):150℃	Tj : 74.2 °C	49.5%	
Z2	CHIP ZENER	Tj(max):150℃	Tj : 75.1 °C	50.0%	
A101	CHIP I.C	Tj(max):150℃	Tj : 62.0 °C	41.3%	

## MODEL : PSS1R5-24-5

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 MAX Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Factor	備考 Note
Q1	CHIP MOS FET	Tch(max):150℃	Tch : 71.5 °C	47.7%	
Q2	CHIP TRANSISTOR	Tj(max):150℃	Tj : 67.1 °C	44.7%	
D101	CHIP S.B.D	Tj(max):150℃	Tj : 73.7 °C	49.1%	
Z2	CHIP ZENER	Tj(max):150℃	Tj : 80.9 °C	53.9%	
A101	CHIP I.C	Tj(max):150℃	Tj : 64.3 °C	42.9%	

## MODEL : PSS1R5-48-5

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 MAX Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Factor	備考 Note
Q1	CHIP MOS FET	Tch(max):150℃	Tch : 77.0 °C	51.3%	
Q2	CHIP TRANSISTOR	Tj(max):150℃	Tj : 66.6 °C	44.4%	
D101	CHIP S.B.D	Tj(max):150℃	Tj : 69.0 °C	46.0%	
Z2	CHIP ZENER	Tj(max):150℃	Tj : 81.1 °C	54.1%	
A101	CHIP I.C	Tj(max):150℃	Tj : 60.9 °C	40.6%	

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise  $\Delta T$  List

MODEL : PSS1R5-\* - 5

## (1) 測定条件 Measuring Conditions

・入力電圧	: 定格	・出力電流	: 100%
Input Voltage	Rated	Output Current	
・周囲温度	: 25°C	・取付方法	: 水平取付 (ケース面上)
Ambient Temperature		Mounting Method	Horizontal Mounting
・冷却方式	: 自然空冷		
Cooling	Convection Cooling		

MODEL : PSS1R5-5-5, PSS1R5-12-5

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	PSS1R5-5-5	PSS1R5-12-5
		温度上昇値 $\Delta T$ Temperature Rise(°C)	温度上昇値 $\Delta T$ Temperature Rise(°C)
Q1	CHIP MOS FET	15.0	17.0
Q2	CHIP TRANSISTOR	15.8	20.2
D101	CHIP S.B.D	18.0	21.4
Z2	CHIP ZENER	18.8	15.7
A101	CHIP I.C	13.8	11.5
L1	CHIP COIL	14.3	16.1
L101	CHIP COIL	12.5	15.8
T1	TRANS.,PULSE	17.4	19.4

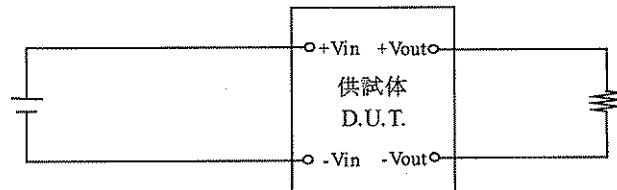
MODEL : PSS1R5-24-5, PSS1R5-48-5

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	PSS1R5-24-5	PSS1R5-48-5
		温度上昇値 $\Delta T$ Temperature Rise(°C)	温度上昇値 $\Delta T$ Temperature Rise(°C)
Q1	CHIP MOS FET	16.7	14.5
Q2	CHIP TRANSISTOR	16.0	15.5
D101	CHIP S.B.D	20.9	16.2
Z2	CHIP ZENER	18.0	12.5
A101	CHIP I.C	14.1	10.7
L1	CHIP COIL	15.3	15.7
L101	CHIP COIL	16.2	14.8
T1	TRANS.,PULSE	20.0	18.0

4. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : PSS1R5-48-5

(1) 試験条件及び回路 Test Condition and Circuit



- ・ 入力電圧 : 76VDC      ・ 出力電流 : 0.3A(100%)
- Input Voltage      Output Current
- ・ 周囲温度 : 25°C
- Ambient Temperature

(2) 試験結果 Test Results

No.	試験箇所 Test Position		試験モード Test Mode		試験結果 Test Results												備考 Note
	部品 Location No.	試験端子 Test Point	S H O R T	O P E N	Fi:Fire Da:Damaged			So:Smoke Fu:Fuse Blown			Bu:Burst NO:No Output		Se:Smell NC:No Change		Re:Red Hot Ot:Others		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					発 火 Fi	発 煙 So	破 裂 Bu	異 臭 Se	発 熱 Re	破 損 Da	ヒ ュ ー ズ 断 Fu	○ V P	○ C P	出 力 断 NO	変 化 な し NC	そ の 他 Ot	
1	Q1	D-S	●								●			●			
2		D-G	●								●			●			
3		G-S	●											●			
4		D		●										●			
5		S		●										●			
6		G		●							●			●			
7	Q2	C-E	●											●			
8		B-E	●						●	●				●			Da:Q1
9		C-B	●											●			
10		C		●						●	●			●			Da:Q1
11		E		●						●	●			●			Da:Q1
12		B		●						●	●			●			Da:Q1

No.	試験箇所 Test Position		試験 モード Test Mode		試験結果 Test Results												備考 Note		
	部品 Location No.	試験端子 Test Point	S H O R T	O P E N	Fi:Fire			So:Smoke			Bu:Burst			Se:Smell				Re:Red Hot	
					Da:Damaged			Fu:Fuse Blown			NO:No Output			NC:No Change				Ot:Others	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
発 火 Fi	発 煙 So	破 裂 Bu	異 臭 Se	発 熱 Re	破 損 Da	ヒ ュー ズ 断 Fu	ヒ ュー ズ 断 Fu	ヒ ュー ズ 断 Fu	ヒ ュー ズ 断 Fu	ヒ ュー ズ 断 Fu	ヒ ュー ズ 断 Fu	ヒ ュー ズ 断 Fu	ヒ ュー ズ 断 Fu	ヒ ュー ズ 断 Fu	ヒ ュー ズ 断 Fu	ヒ ュー ズ 断 Fu	ヒ ュー ズ 断 Fu		
13	L1		●														●		
14	L1			●													●		
15	L101		●															● リップル大 Output ripple increase	
16	L101			●							●	●					●	Da:Q1	
17	D3		●															● 効率低下 Efficiency down	
18	D3			●														● 出力電圧上昇 Output voltage go up	
19	D101		●								●	●					●	Da:Q1	
20	D101			●							●	●					●	Da:Q1	
21	Z2		●											●					
22	Z2			●													●		
23	A101	K-A	●															● 出力電圧低下 Output voltage go down	
24	A101	K-R	●															● 出力電圧低下 Output voltage go down	
25	A101	A-R	●								●	●					●	Da:Q1	
26	A101	K		●							●	●					●	Da:Q1	
27	A101	A		●							●	●					●	Da:Q1	
28	A101	R		●							●	●					●	Da:Q1	
29	PC1	K-A	●								●	●					●	Da:Q1	
30	PC1	C-E	●								●	●					●	Da:Q1	
31	PC1	K		●							●	●					●	Da:Q1	
32	PC1	A		●							●	●					●	Da:Q1	
33	PC1	C		●							●	●					●	Da:Q1	
34	PC1	E		●							●	●					●	Da:Q1	
35	C1		●									●					●		
36	C1			●													●		
37	C3		●														●		
38	C3			●							●	●					●	Da:Q1	
39	C4		●														●		
40	C4			●							●	●					●	Da:Q1	
41	C5		●								●	●					●	Da:Q1	
42	C5			●										●					
43	C6		●														●		
44	C6			●													●		
45	C7		●														●		
46	C7			●													●		
47	C101		●								●	●					●	Da:Q1	
48	C101			●													●	リップル大 Output ripple increase	
49	C102		●											●					
50	C102			●													●	リップル大 Output ripple increase	
51	C104		●														●	出力電圧低下 Output voltage go down	
52	C104			●													●	リップル大 Output ripple increase	
53	C105		●								●	●					●	Da:Q1	
54	C105			●													●		







## 5. 振動試験 Vibration Test

MODEL : PSS1R5-48-5

## (1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency Variable Endurance Test

## (2) 使用振動試験装置 Equipment Used

EMIC (株)製  
EMIC CORP.制御部 F-400-BM-E47  
Controller加振部 905-FN  
Vibrator

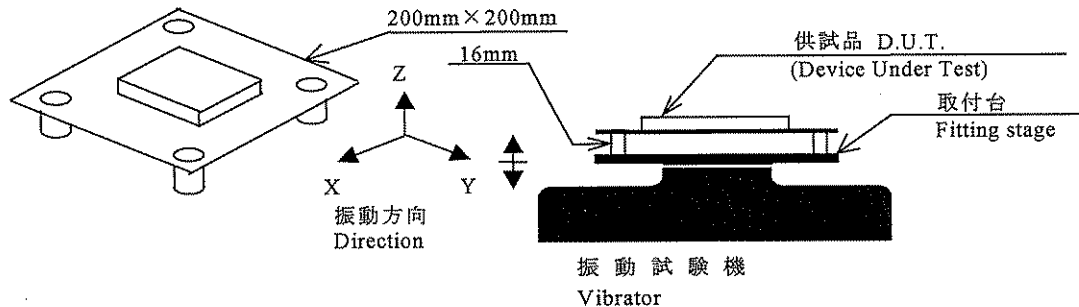
## (3) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

1 台 (unit)

## (4) 試験条件 Test Conditions

- ・周波数範囲 Sweep Frequency 10~55Hz
- ・掃引時間 Sweep Time 1分間 1 min.
- ・振幅 Amplitude 一定 (1.52mm) const.
- ・振幅方向 Direction X, Y, Z
- ・試験時間 Test Time 2 時間 2 hour each

## (5) 試験方法 Test Method



供試品を基板に取付け(入出力信号ピンをはんだ付け)、それを取付台に固定する。  
Fix the D.U.T. on the circuit board (soldering Input Output signal terminals) and fix it on the fitting-stage.

## (6) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・測定条件 Measuring Conditions

入力電圧 : 48VDC      出力電流 : 0.3A(100%)  
Input Voltage              Output Current

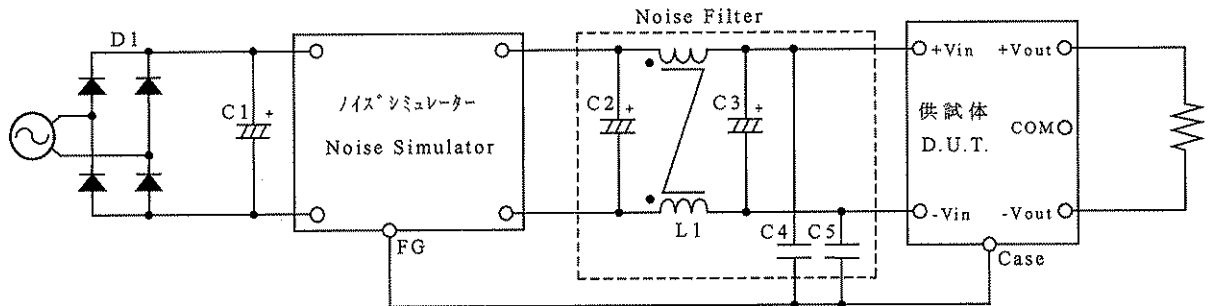
周囲温度 : 25°C  
Ambient Temperature

測定確認項目 Check Item	出力電圧 (V) Output Voltage	リップル電圧 (mVp-p) Ripple Voltage	機構・実装状態 D.U.T. State	
試験前 Before Test	4.998	6.8	異常なし OK	
試験後 After Test	X	4.998	7.2	異常なし OK
	Y	4.998	7.1	異常なし OK
	Z	4.999	7.2	異常なし OK

6. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : PSS1R5-\*\*-5

(1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



- ・ノイズシミュレーター Noise Simulator : INS-4320 (ノイズ研究所) (Noise Laboratory Co.,LTD.)
- ・ブリッジダイオード (D1) Bridge Rectifier : PGH758AM (日本インター) (Nihon Inter)

入力電圧 Input Voltage	5V	12V	24V	48V
・コモンモード・チョークコイル (L1) Common-mode Choke Coil	0.2mH	0.2mH	2mH	2mH
・電解コンデンサ (C1) Electrolytic Cap.	16V 2200 $\mu$ F	35V 470 $\mu$ F	50V 470 $\mu$ F	100V 470 $\mu$ F
・電解コンデンサ (C2) Electrolytic Cap.	16V 4.7 $\mu$ F	35V 4.7 $\mu$ F	50V 10 $\mu$ F	100V 10 $\mu$ F
・電解コンデンサ (C3) Electrolytic Cap.	16V 100 $\mu$ F	35V 100 $\mu$ F	50V 100 $\mu$ F	100V 47 $\mu$ F
・セラミックコンデンサ (C4,C5) Ceramic Cap.	3kV 2200pF	3kV 2200pF	3kV 4700pF	3kV 4700pF

(2) 試験条件 Test Conditions

- ・入力電圧 Input Voltage : 定格 Rated
- ・出力電圧 Output Voltage : 定格 Rated
- ・出力電流 Output Current : 100%
- ・周囲温度 Ambient Temperature : 25°C
- ・パルス幅 Pulse Width : 50ns,1000ns
- ・ノイズ電圧 Noise Level : 0~0.5kV
- ・極性 Polarity : +, -
- ・モード Mode : ノーマル、コモン Normal, Common
- ・トリガ周波数 Trigger Frequency : 20Hz~62.5Hz

(3) 判定条件 Acceptable Conditions

- 1.破壊しない事 Not to be broken
- 2.出力がダウンしない事 Not to be shut down output
- 3.その他異常のない事 No other out of orders

(4) 試験結果 Test Result

合格 OK

## 7. はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test

MODEL : PSS1R5-48-5

## (1) 使用装置 Equipment Used

自動ハンダ付け装置 : TLC-350XIV (東京生産技研)  
AUTOMATIC DIP SOLDERING MACHINE (TSG)

## (2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

1 台 (unit)

## (3) 試験条件 Test Conditions

- ・ 溶解はんだ温度 : 260°C  
Dip soldering temperature
- ・ 浸漬保持時間 : 10秒  
Dip time 10 seconds
- ・ 予備加熱温度 : 120°C  
Pre-heating temperature
- ・ 予備加熱時間 : 60秒  
Pre-heating time 60 seconds

## (4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を基板にのせ、自動はんだ付け装置でフラックス浸漬、予備加熱、はんだ付けを行う。常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. on circuit board, transfer to flux-dipping, pre-heating, and soldering in the automatic dip soldering machine. Leave it for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

## (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・ 測定条件 Measuring Conditions

入力電圧 : 48VDC      出力電流 : 0.3A(100%)      周囲温度 : 25°C  
Input Voltage      Output Current      Ambient Temperature

測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	4.985	4.989
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	8.0	7.9
入力変動 Line Regulation	mV	1	1
負荷変動 Load Regulation	mV	4	2
絶縁抵抗 Insulation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK

## 8. 熱衝撃試験 Thermal Shock Test

MODEL : PSS1R5-48-5

### (1) 使用計測器 Equipment Used

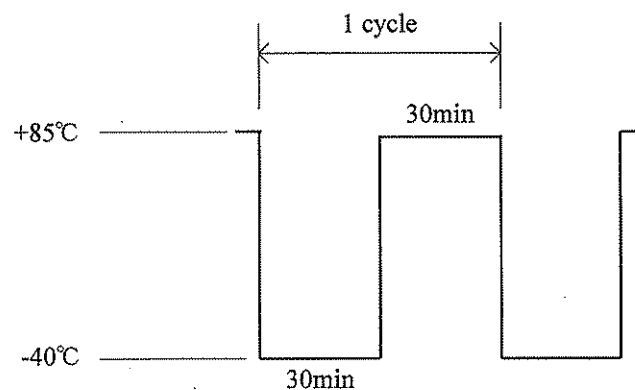
THERMAL SHOCK CHAMBER TSV-40 (TABAI ESPEC CORP.)

### (2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

10 台 (units)

### (3) 試験条件 Test Conditions

- ・電源周囲温度 :  $-40^{\circ}\text{C} \Leftrightarrow +85^{\circ}\text{C}$   
Ambient Temperature
- ・試験時間 : 30min  $\Leftrightarrow$  30min  
Test Time



- ・試験サイクル : 200、500 サイクル  
Test Cycles 200, 500 cycles
- ・非動作  
Not Operating

### (4) 試験方法 Test Method

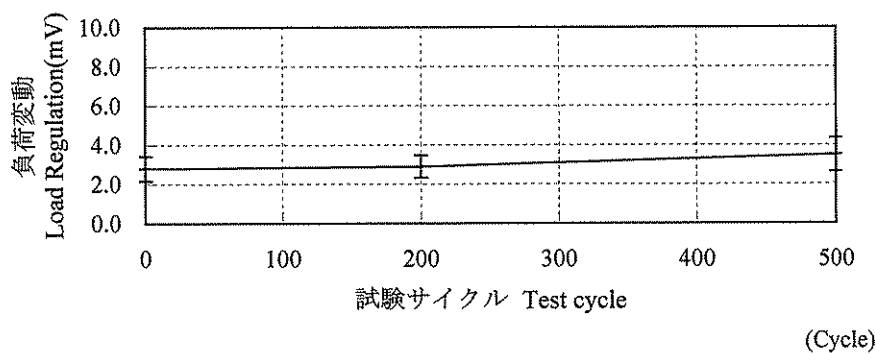
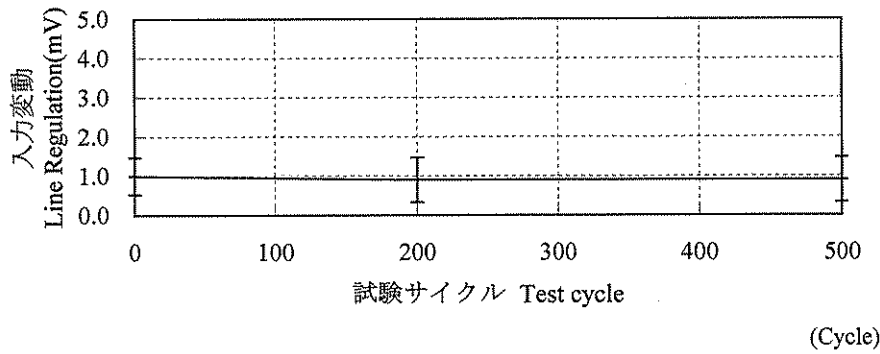
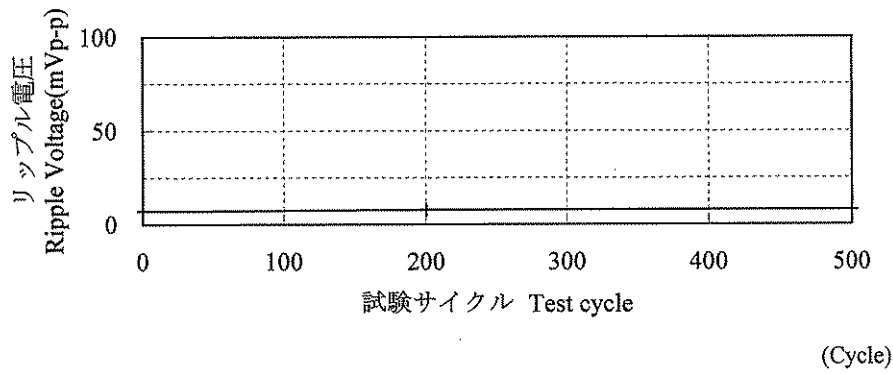
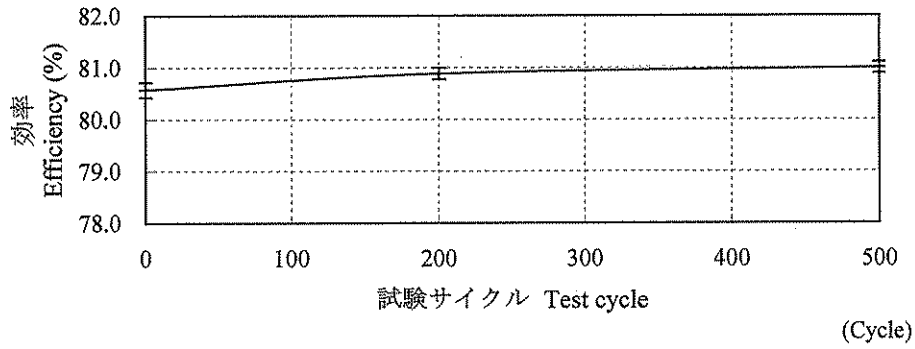
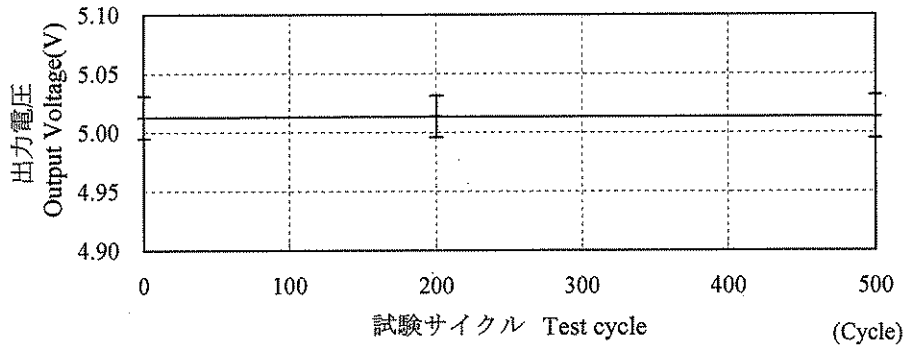
初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。200、500 サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before the test check if there is no abnormal output and put the D.U.T. in the testing chamber. Then test it in the above cycles. After the test is completed leave it for 1 hour at room temperature and check it if there is no abnormal output.

### (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

測定データは、次頁に示す。  
See next page for measuring data.



## 9. 高温貯蔵試験 High Temperature Storage Test

MODEL : PSS1R5-48-5

## (1) 使用計測器 Equipment Used

TEMPERATURE CHAMBER SU240 (TABAI ESPEC CORP.)

## (2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

3 台 (units)

## (3) 試験条件 Test Conditions

・ 電源周囲温度 : 85°C	・ 試験時間 : 100時間	・ 非動作
Ambient Temperature	Test Time 100 hours	Not operating

## (4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、槽の温度を室温 (25°C) から規定の温度 (85°C) まで徐々に上げる。供試品を規定温度で100時間放置し、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually increased from 25°C to 85°C. Leave the D.U.T. for 100 hours at 85°C and for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

## (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・ 測定条件 Measuring Conditions

入力電圧 : 48VDC	出力電流 : 0.3A(100%)	周囲温度 : 25°C
Input Voltage	Output Current	Ambient Temperature

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	5.009	5.007	5.025	5.024	4.984	4.985
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	8.0
入力変動 Line Regulation	mV	1	1	0	1	1	1
負荷変動 Load Regulation	mV	4	5	3	3	3	4
絶縁抵抗 Insulation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK



## 10. 低温貯蔵試験 Low Temperature Storage Test

MODEL : PSS1R5-48-5

## (1) 使用計測器 Equipment Used

TEMPERATURE CHAMBER SU240 (TABAI ESPEC CORP.)

## (2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

3. 台 (units)

## (3) 試験条件 Test Conditions

・電源周囲温度 : -40°C	・試験時間 : 100時間	非動作
Ambient Temperature	Test Time 100 hours	Not operating

## (4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、槽の温度を室温 (25°C) から規定の温度 (-40°C) まで徐々に下げる。供試品を規定温度で100時間放置し、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually decreased from 25°C to -40°C. Leave the D.U.T. for 100 hours at -40°C and for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

## (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・測定条件 Measuring Conditions

入力電圧 : 48VDC	出力電流 : 0.3A(100%)	周囲温度 : 25°C
Input Voltage	Output Current	Ambient Temperature

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	5.008	5.009	5.024	5.025	4.983	4.984
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	7.6	7.8	7.5	7.7	7.7	7.9
入力変動 Line Regulation	mV	2	1	1	0	0	1
負荷変動 Load Regulation	mV	3	4	3	3	2	3
絶縁抵抗 Insulation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

## 1 1. 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test

MODEL : PSS1R5-48-5

## (1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP.&amp; HUMID. CHAMBER PSL-2SPH (TABAI ESPEC CORP.)

## (2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

2 台 (units)

## (3) 試験条件 Test Conditions

・周囲温度 : 85°C Ambient Temperature	・湿度 : 95%RH Humidity	・試験時間 : 1000時間 Test Time
・入力電圧 : 48VDC Input Voltage	・出力電圧 : 定格 Output Voltage Rated	・出力電流 : 0A(0%) Output Current

## (4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、槽の温度を室温（25°C）から周囲温度が規定の温度（85°C）になるまで徐々に上げる。供試品を規定の条件にて1000時間動作させ、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually increased from 25°C to 85°C. Operate the D.U.T. for 1000 hours according to above conditions and leave D.U.T for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

## (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・測定条件 Measuring Conditions

入力電圧 : 48VDC Input Voltage	出力電流 : 0.3A (100%) Output Current	周囲温度 : 25°C Ambient Temperature
-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

		No.1		No.2	
測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	5.003	5.005	5.011	5.015
リップル電圧 Ripple Voltage	mVp-p	7.4	10.9	7.3	10.5
入力変動 Line Regulation	mV	1	1	2	1
負荷変動 Load Regulation	mV	3	2	2	3
絶縁抵抗 Insulation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

## 1 2. 高温連続通電試験 High Temperature Bias Test

MODEL : PSS1R5-48-5

## (1) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

5 台 (units)

## (2) 試験条件 Test Conditions

・周囲温度 : 50℃	・試験時間 : 1000時間		
Ambient Temperature	Test Time	1000 hours	
・入力電圧 : 48VDC	・出力電圧 : 定格	・出力電流 : 0.3A(100%)	
Input Voltage	Output Voltage	Rated	Output Current

## (3) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を規定の条件にて1000時間動作させ、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Operate the D.U.T. for 1000 hours according to above conditions and leave D.U.T for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

## (4) 試験結果 Test Results

合格 OK

測定データは、次頁に示す。

See next page for measuring data.

・測定条件 Measuring Conditions

入力電圧 : 48VDC

出力電流 : 0.3A(100%)

周囲温度 : 25℃

Input Voltage

Output Current

Ambient Temperature

測定確認項目 Check Item		No.1		No.2		No.3	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	5.035	5.037	5.016	5.017	4.998	5.001
リップル 電圧 Ripple Voltage	mVp-p	7.9	11.6	7.4	10.8	7.5	10.8
入力変動 Line Regulation	mV	1	0	2	2	1	1
負荷変動 Load Regulation	mV	2	3	3	3	3	2
絶縁抵抗 Insulation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK

測定確認項目 Check Item		No.4		No.5	
		試験前 Before Test	試験後 After Test	試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	4.988	4.991	5.028	5.031
リップル 電圧 Ripple Voltage	mVp-p	7.8	11.4	7.9	11.3
入力変動 Line Regulation	mV	0	1	1	1
負荷変動 Load Regulation	mV	4	3	4	3
絶縁抵抗 Insulation Resistance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
耐電圧 Withstand Voltage	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK
外観 Appearance	—	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK	異常なし OK